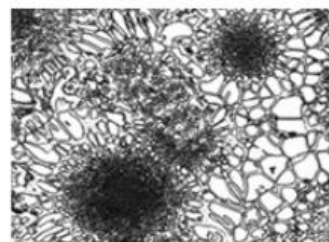
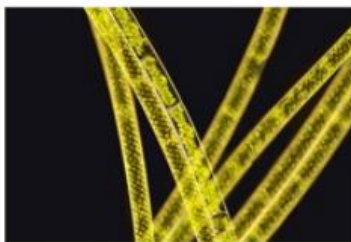
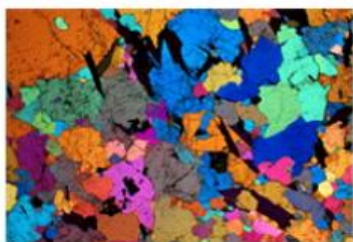




Odwrócony mikroskop metalurgiczny w systemie trin okularowym IMM-70 jest wyposażony w doskonały układ optyczny UIS i funkcję modularyzacji z funkcją polaryzacji, obserwacji w ciemnym polu. Kompaktowy i stabilny korpus ramy głównej jest odporny na wstrząsy. Idealna ergonomiczna konstrukcja zastosowana w tym urządzeniu zapewnia łatwiejszą obsługę dzięki powiększonej przestrzeni roboczej. Jest to idealny przyrząd optyczny do mikro obserwacji struktury metalurgicznej i morfologii powierzchni.

Kamera zapewnia uzyskiwanie obrazu: spolaryzowane, w ciemnym świetle a także odbitym



Mikroskop metalograficzny z oprogramowaniem do analizy:

Ziarna wtrącenia metaliczne i niemetaliczne oraz pomiary: długość, szerokość, pola powierzchni, itp., możliwość zliczenia obiektów, obliczenie udziału ilościowego i procentowego grubości warstwy.

Możliwość tworzenia dokumentacji w postaci raportu. Badanie kształtu i klasyfikację rozmiaru grafitu, guzkowatość, grafit, ferrytowe, frakcje perlitu i inne podstawowe statystyki analizy żelaza.

Posiada możliwość dostosowania funkcjonalności, zawiera maski obrazu. Klasyfikacja ograniczenia rozmiaru i kształtu guzek oraz wielkość ziarna, liczba ziaren i inne statystyki podstawowe wielkości ziarna.

Mikroskop w układzie odwróconym do obserwacji próbek nieprzezroczystych w świetle odbitym (EPI-światło dobite) w jasnym i ciemnym polu powiększeniu w zakresie do 1000x. tor optyczny pozwalający na podłączenie cyfrowej kamery mikroskopowej lub aparatu fotograficznego i zapisywanie zdjęć, dokonywanie pomiarów. Prowadzenie obserwacji cech istotnych z punktu

widzenia inżynierii materiałowej i kontroli jakości. Używany jest do badania struktury metali i ich stopów (zgłady metalograficzne), do wykrywania mikropęknięć, oceny chropowatości i nośności powierzchni, oceny mikrostruktury tworzyw, analizy elementów elektronicznych (np. układy scalone), dokonywania pomiarów. Obserwacja i identyfikacja stopów metali, oraz badanie ich struktury (kształt, wymiary, ilość, rozmieszczeni składników), wykrycie wad budowy struktury lub materiału, badanie mechanizmów przemian fazowych i identyfikację faz, odtworzenie zastosowanych procesów technologicznych oraz badanie zjawisk zachodzących w trakcie eksploatacji materiałów.

Nasadka trinokularowa o kącie pochylenia 45 stopni, rozstaw okularów 53~75mm, 45 stopni, regulacja dioptryjna.

Okular 10x o polu widzenia 22mm

Obiektywy suche o powierzchniach:

PLANachromat 5X/0.10 WD=26.12mm

PLANachromat 10X/0.10 WD=20.20mm

PLANachromat 20X/0.25 WD=8.80mm

PLANachromat 50X/0.40 WD=3,68mm

PLANachromat100X/0,85(Dry) WD=0.40mm

Stolik XY sterowany manualnie

Filtry: niebieski, zielony, żółty

Prosty polaryzator i analizator.

Oprogramowanie do analizy metalograficznej. Kamera cyfrowa CMOS-5mIn pixl (USB) wraz z adapterem umożliwiającym odwzorowanie obrazu rzeczywistego na ekranie komputera.

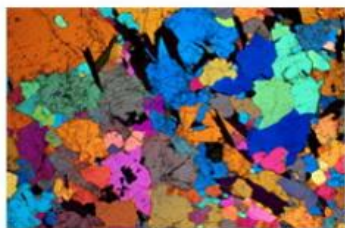
Instrukcja w języku polskim

Oprogramowanie do badań

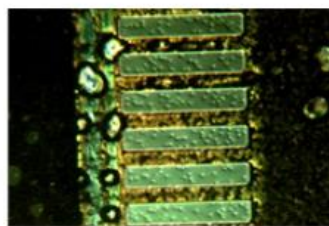
Certyfikat producenta

Certyfikat CE.

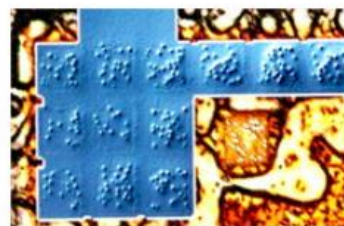
Digital camera photography:



Polarized observe



DIC observe



DIC observe

